

中小企業や新興国における知財情報の戦略的活用

—巡回特許庁・JICA での講演経験から—

Strategic use of IP Information by SMEs and emerging countries
—From the experience as a speaker at the Circuit Japan Patent Office and JICA—



サン・グループ（特許業務法人藤本パートナーズ・株式会社ネットス・株式会社パトラ）代表

藤本 周一

2000年株式会社ネットス入社。国内特許調査担当後、国際部を立ち上げ外国知財調査・分析業務を担当。2011年同社代表取締役社長就任。2018年より現職。大学、巡回特許庁、JICA等で知財情報に関する講演実績多数。

✉ nets-fujimoto@sun-group.co.jp

1 はじめに

2017年9月、2018年2月に、特許庁と近畿経済産業局主催で開催された～巡回特許庁 in KANSAI～⁽¹⁾において、主に中小企業の知財関係者延べ約300名を対象に、筆者と、特許業務法人 藤本パートナーズの意匠部部門長である石井隆明弁理士とで、「パテントマップ概論」、「意匠マップ」について講演を行った。



図1 巡回特許庁にて

また、2018年7月に、JICA（独立行政法人国際協力機構）主催で開催された新興国知財実務者研修事業において、バングラデシュ、カンボジア、エチオピア、メキシコ、ネパール、スリランカ、タンザニア、ケニアなどの知財関係者を対象に、筆者が「Search and analysis of Intellectual Property Information」について講演を行った。

これらの講演経験から筆者が感じた、中小企業や新興国における知財情報の戦略的活用について紹介したい。

2 中小企業における知財情報活用

2.1 中小企業の環境変化

巡回特許庁でも感じたが、特に中小企業では知財担当者だけでなく、経営者においても知財情報の活用を推進している企業が増えてきているように思う。

昨年から INPIT（独立行政法人工業所有権情報・研修館）が実施している中小企業等特許情報分析活用支援事業⁽²⁾でも、全国の中小・中堅企業の経営者が積極的に本事業を利用し、知財調査や知財分析（パテントマップ）を自社の知財戦略、事業戦略に活用している。

当グループにおいても、年間数百社の中小企業から知財相談を受けるが、近年依頼が多い相談として、自社の事業戦略、経営戦略に即した知財の活用をどのように行えばいいかといった、実際のビジネスに直結した相談が増えてきている。

このような環境変化に伴い、例えば当グループの顧問会社の一つである、100円均一ショップの最大手企業では、販売する商品をメーカーから購入する際に、商品が他社の権利を侵害していないか他社の知財情報の確認を昨年からは行っている。これにより販売後の知財リスク、事業リスクの軽減に繋がっている。

2.2 特許・意匠情報の活用

以前から、知的財産部があるような大手企業では、侵

害予防や、他社権利の無効化、出願の登録性等の確認を目的とした特許調査や意匠調査、技術トレンドや他社動向の把握、新規テーマ探索を目的とした特許マップ（パテントマップ）、意匠マップ（デザインマップ）のような知財情報の活用は行われている。

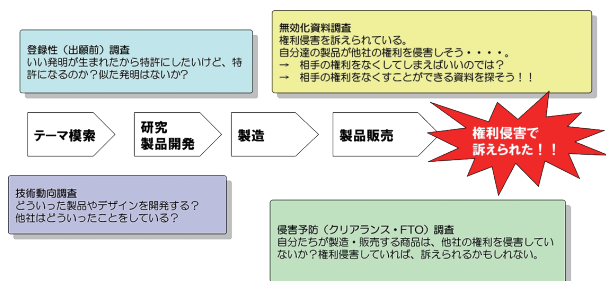


図2 知財調査の種類とタイミング

しかしながら、本来知財情報の活用は、中小企業においても積極的に行われるべきであり、特に中小企業の場合は大企業に比べ、知財担当者と経営層との距離が近いいため、より事業や経営にリンクした知財情報の活用が可能であると筆者は考える。

中小企業において、特に重要になってくる知財情報活用としては、自社製品が他社権利を侵害しないための侵害予防調査、そして新規事業の探索や M&A の相手先分析など、経営や事業の方向性を決定する上のツールとなる特許マップや意匠マップではないだろうか。

2.2.1 侵害予防調査の注意点

侵害予防調査で最も重要なことの一つは、特許調査や意匠調査を始める前に、「自社の技術やデザインのどこがポイント（特徴）なのか」をしっかりと検証することである。

このポイント把握を間違えると、意味のない調査を実施することとなるため、研究者や開発者、デザイナーなどと事前の協議をしっかりと行う必要があり、調査を外委託する場合は、委託先の弁理士やサーチャーにも事前協議に参加してもらうことで、より精度の高い調査が可能となる。

実際の調査段階では、特許調査、意匠調査共に、調査する分類特定が極めて重要で、無効資料調査など他の調査と異なり、特許、意匠共に使用する分類（IPC、CPC、FI、日本意匠分類、ロカルノ分類等）は、積極的に除外できる理由がない限り、上位の分類を含む検索

条件を設定する。分類の定義の確認は、IPC、FI 等はパテントマップガイダンス⁽³⁾、日本意匠分類は分類定義カード⁽⁴⁾を利用して確認する。

なお、調査結果に基づき、抵触する可能性がある権利が発見された場合は、設計変更の必要性や回避策を早急に検討し、設計変更した場合には、設計変更後のポイントで再度調査を行うことが望ましい。

また、製品によっては、他社権利に抵触しなくても、不正競争防止法に該当してしまう場合もあるため、この点についてもインターネット検索など、できる範囲で調査を事前に行うことが必要となる。

2.2.2 特許マップ（パテントマップ）の活用

最近、IP ランドスケープという言葉聞く機会が増えたが、IP ランドスケープの思想自体は古くからあり、経営や事業に貢献する知財情報活用というのは、従来から成されてきたはずであるが、真の意味で経営や事業に貢献する知財情報活用というのは、実際にはかなりハードルが高く、知財部や知財担当者だけでなく、経営層や事業部との連携が必要不可欠である。

前述したように、中小企業では大企業よりも知財担当と経営層の距離が近いことが多いため、後述する意匠マップもそうであるが、より戦略的に特許マップを活用できるものとする。

特許マップには目的別に多数の種類があるが、中でも最近特に中小企業からの相談が多いのが、新規事業立案やコア技術の用途展開を目的とした特許マップである。このようなマップの依頼背景には、自社技術の売り込み先や、自社のコア技術を活用した新規事業への参入など、経営や事業的課題を解決するためのツールとしての活用目的が多い。

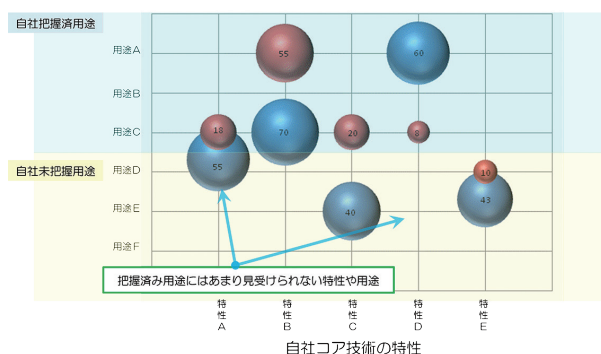


図3 自社コア技術の新規用途展開マップ

また、最近では特許と意匠、さらには商標を融合させた知財ミックスマップや知財ミックス戦略も注目されており、製品や、製品群に関する多面的な知財ポートフォリオを構築することで、市場の独占化を進める動きもある。

2.2.3 意匠マップ（デザインマップ）の活用

特許マップ同様、意匠マップにもいくつかの種類があり、代表的なものとしては、①公知意匠マップ、②登録意匠マップ（類否マップ）、③デザイン動向マップ、④出願戦略マップがあげられる。

表1 意匠マップの種類と目的

種類	目的
①公知意匠マップ	類似（似ている）範囲の分析 ※登録されていない意匠も含む
②登録意匠マップ（類否マップ）	類似（似ている）範囲の分析 ※登録されている意匠
③デザイン動向マップ	権利化されていないデザイン領域の分析
④出願戦略マップ	意匠戦略検討時に作成

類似、非類似の判断は非常に難しく、中小企業の場合は意匠を専門的に扱っている外部の弁理士に相談することも多いと思うが、②登録意匠マップのように、特許庁の判断により登録されている意匠をベースに作成するマップであれば、比較的類否の関係が分かり易いのではないだろうか。

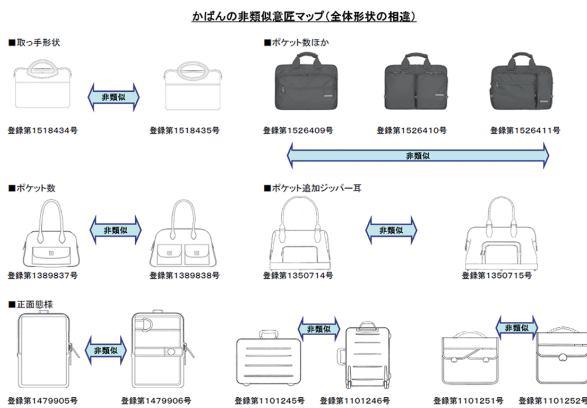


図4 登録意匠マップの例

また、③デザイン動向マップでは、自社や他社の製品におけるデザインの動向を確認するのに役立つため、開発段階の参考ツールとしてのニーズが高い。このようなデザイン動向マップは、国内だけでなく海外の意匠権も含めて作成することで、海外での製品販売戦略立案にも役立つ。

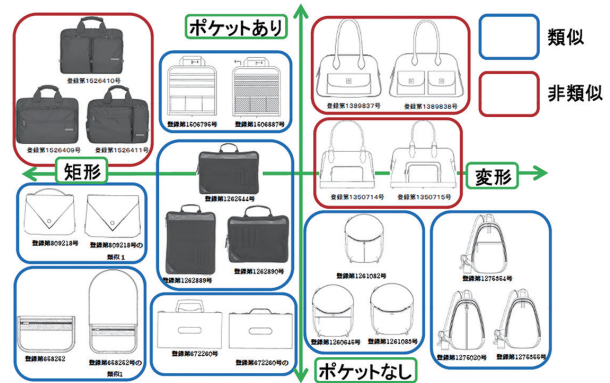


図5 デザイン動向マップの例

④出願戦略マップでは、どのようなデザインポートフォリオを構築したいか、そのための意匠出願をどのように行うかを検討する上で役立つ。例えば、全てのデザインパターンを出願しなくても、いくつかの形状変化意匠を関連意匠とすることで、保護範囲や牽制効果が広がることもある。

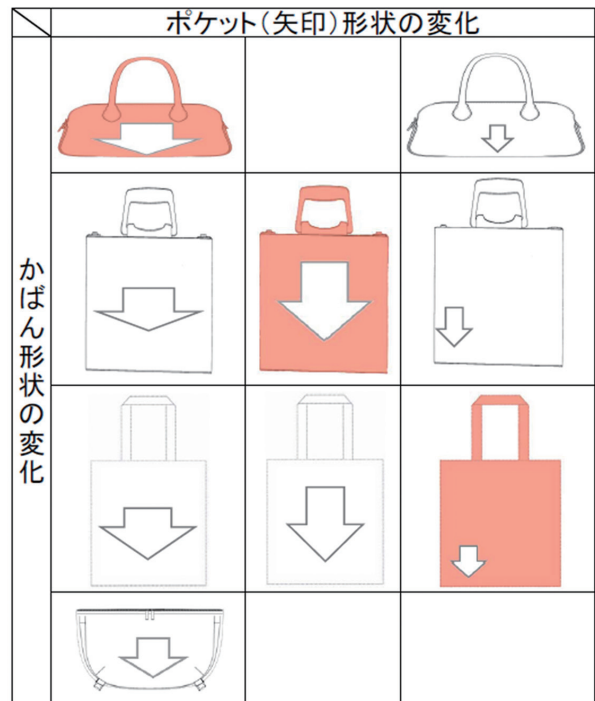


図6 出願戦略マップの例

前述したような意匠マップを、自社権利の評価、他社権利の分析、新規事業（製品）の方針等目的別に活用し、事業や経営に役立てようとする企業が増えてきている。

3 新興国における知財情報活用

前述した JICA での講演を通じて感じたことは、新興国では知財実務者であっても、特許調査など知財情報の

活用を行っている国はほとんどないということである。

ただ、彼等自身は日本企業がどのような目的や方法で知財情報を活用しているかについてとても関心が高く、J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）の英語での検索方法⁽⁵⁾や、世界知的所有権機関（WIPO）が提供する PATENTSCOPE⁽⁶⁾でのグローバル調査方法については非常に興味を示し、質問が多く飛び交った。

今回の JICA 研修を機に、新興国での知財情報の活用普及に繋がることを切に願う。



図7 JICA 新興国知財実務者研修事業にて

4 おわりに

巡回特許庁や JICA での講演経験は、筆者にとって大変貴重な経験となった。講演後にも多くの方から相談や質問を受け、業務で抱えている課題など共有できた。

今回このような機会をいただいた、特許庁、近畿経済産業局、JICA はじめ関係者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げる。

補足・参考文献

- (1) 巡回特許庁：
<https://www.junkai-jpo2018.go.jp/>
- (2) 中小企業等特許情報分析活用支援事業：<https://ip-bunseki.go.jp>
- (3) パテントマップガイダンス：
https://www5.j-platpat.inpit.go.jp/pms/tokujitsu/pmgs/PMGS_GM101_Top.action
- (4) 日本意匠分類 分類定義カード：
https://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/isyous_bunrui.htm
- (5) J-PlatPat EnglishPage：
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage>
- (6) PATENTSCOPE：
<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf;jsessionid=33FB54DE10F9AD9C2BB80F7E7D75FD6A.wapp1nA>